Обменное усиление *g*-фактора электронов в напряженных гетероструктурах InGaAs/InP

© С.С. Криштопенко^{+*}, К.В. Маремьянин^{+*¶}, К.П. Калинин^{+†}, К.Е. Спирин^{+*•}, В.И. Гавриленко^{+*}, Н. В. Байдусь^{*}, Б.Н. Звонков^{*}

⁺ Институт физики микроструктур Российской академии наук,

* Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

603950 Нижний Новгород, Россия

[†] Московский физико-технический институт (факультет общей и прикладной физики),

141700 Долгопрудный, Московская обл., Россия

International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures,

95 Gajowicka str., 53-421, Wroclaw, Poland

(Получена 23 мая 2014 г. Принята к печати 16 июня 2014 г.)

Исследовано обменное усиление g-фактора в напряженных гетероструктурах InGaAs/InP с двумерным электронным газом. Из анализа температурной зависимости сопротивления в минимумах осцилляций Шубникова-де Гааза в перпендикулярных магнитных полях до 12 Тл вблизи нечетных факторов заполнения уровней Ландау определены значения эффективного фактора Ланде электронов $g^* = -(8.6 - 10.1)$. Полученные экспериментальные значения сравниваются с теоретическими расчетами g-фактора квазичастиц, выполненных с использованием 8-зонного $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ -гамильтониана с учетом обменного взаимодействия в двумерном электронном газе. Показано, что в условиях сильного перекрытия расщепленных по спину уровней Ландау максимум g-фактора квазичастиц может достигаться вблизи четных значений фактора заполнения, что обусловлено непараболичностью закона дисперсии электронов.

1. Введение

Исследования магнитотранспорта [1-5], резонансного туннелирования [6-8], теплоемкости [9-11], а также емкостная спектроскопия уровней Ландау [12,13] в структурах с двумерным (2D) электронным газом, помещенных в сильное магнитное поле, позволяют определять величину спинового расщепления на уровне Ферми и g-фактор квазичастиц. Значения g-фактора, полученные таким образом, зависят от магнитного поля, уширения полосы плотности состояний и фактора заполнения уровней Ландау. Величина *g*-фактора квазичастиц при этом может значительно отличаться от "одноэлектронных" значений, полученных из измерений спинового резонанса в том же образце, что связано с обменным взаимодействием между электронами [14,15]. В работе [15] было показано, что g-фактор квазичастиц является осциллирующей функцией фактора заполнения уровней Ландау. При нечетных факторах заполнения наблюдается значительное усиление g-фактора, измеряемого в магнитотранспорте, обусловленное максимальной разностью в концентрациях электронов с противоположными спинами. При четных факторах заполнения в 2D электронном газе с параболическим законом дисперсии обменное усиление g-фактора квазичастиц отсутствует. В этом случае величина *g*-фактора квазичастиц совпадает со значением, измеряемым в спиновом резонансе. Отметим, что в соответствии с теоремой Лармора [16,17] в 2D структурах в отсутствие спин-орбитального (CO) взаимодействия электрон-электронное взаимодействие не оказывает влияния на величину д-фактора, измеряемого в спиновом резонансе.

Непараболичность электронных подзон и выраженное СО взаимодействие, характерные для 2D структур на основе узкозонных полупроводников, таких как InAs [5,18–21] и InSb [22–26], приводят к новым эффектам, связанным с электрон-электронным взаимодействием, в режиме целочисленного и дробного квантового эффекта Холла, которые в 2D системах с параболичным законом дисперсии не наблюдаются [27–30]. Кроме этого, непараболичность подзон также оказывает значительное влияние на обменное усиление *g*-фактора в таких структурах.

Использование твердых растворов GaAs с узкозонными полупроводниками позволяет, с одной стороны, получать 2D структуры с меньшей шириной запрещенной зоны, а с другой, — управлять эффектами CO взаимодействия путем изменения доли GaAs в твердом растворе, что открывает дополнительные возможности для спиновой инженерии. Типичным представителем таких структур являются гетероструктуры InGaAs/InP с квантовыми ямами (КЯ).

Экспериментальные исследования *g*-фактора квазичастиц в 2D системах на основе InGaAs/InP проводились в работах [31–34], в которых значения *g*-фактора определялись из анализа положений максимумов магнитосопротивления при различных углах наклона магнитного поля (метод совпадений). В работах [31,32] исследовалось обменное усиление *g*-фактора в 2D электронном газе на гетеропереходе In_{0.53}Ga_{0.47}As/InP. Из анализа осцилляций Шубникова–де Гааза (ШдГ) в наклонных магнитных полях *B* в интервале температур T = 2-10 K для образца с концентрацией электронов 4.8 · 10¹¹ см⁻² и подвижностью 125 000 см²/В · с была определена величина *g*-фактора квазичастиц — (4.50 ± 0.25) [31]. В ра-

⁶⁰³⁹⁵⁰ Нижний Новгород, Россия

[¶] E-mail: kirillm@ipmras.ru

боте [32] значения *g*-фактора квазичастиц в структуре с концентрацией электронов $3.7 \cdot 10^{11}$ см⁻² и подвижностью $34\,000$ см²/В · с составляли от -2 до -24 для различных пар расщепленных по спину уровней Ландау.

Обменное усиление g-фактора в структурах с КЯ In_{0.53}Ga_{0.47}As/InP впервые исследовалось в [33]. Значения g-фактора квазичастиц близи нечетных факторов заполнения уровней Ландау $\nu = 3, 5, 7$ варьировались от -3 до -5 в зависимости от ширины КЯ (от 8 до 15 нм) и номера уровня Ландау. Исследования обменного усиления g-фактора вблизи четных факторов заполнения уровней Ландау в КЯ In_{0.53}Ga_{0.47}As/InP шириной 450 и 600 нм проводились в [34]. Величина g-фактора квазичастиц при $\nu = 2$ в образцах с различными шириной КЯ и подвижностью электронов изменялась от -5.6 до -11.5. Отметим, что обменное усиление *g*-фактора квазичастиц при четных факторах заполнения уровней Ландау имеет место только в 2D системах с непараболичностью закона дисперсии и выраженным спин-орбитальным взаимодействием [35–37].

Таким образом, величина обменного усиления *g*-фактора квазичастиц в 2D системах на основе InGaAs/InP зависит не только от номера и фактора заполнения уровней Ландау, но также от концентрации и подвижности 2D электронного газа. Отметим, что значения *g*-фактора в KЯ InGaAs/InP, определенные из спинового резонанса, составляют -(2.0-5.6) в зависимости от ширины, массовой доли GaAs и концентрации 2D электронов в KЯ [38–41].

Данная работа посвящена исследованию обменного усиления "магнитотранспортного" g-фактора квазичастиц в напряженных структурах $In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP$ с симметричным профилем КЯ. Значения g-фактора квазичастиц определялись из анализа температурной зависимости сопротивления в минимумах осцилляций ШдГ в перпендикулярных магнитных полях вблизи нечетных факторов заполнения уровней Ландау. Для описания результатов измерений были выполнены теоретические расчеты величины обменного усиления g-фактора квазичастиц с использованием 8-зонного $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ -гамильтониана [35–37] с зонными параметрами, использованными нами ранее при описании результатов измерений магнитотранспорта и циклотронного резонанса в этих структурах [42].

2. Эксперимент

Для исследования магнитотранспорта в перпендикулярных магнитных полях методом МОС-гидридной эпитаксии (газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений) на полуизолирующих подложках InP (001) был выращен образец s7131 с симметричным профилем КЯ (в отличие от образцов из работы [42]) шириной 10 нм. Толщины нелегированного буферного и покровных слоев InP составляли 500 и 250 нм. Для создания 2D электронного газа в обоих барьерах InP на расстоянии 10 нм от КЯ осуществлялось легирование кремнием с концентрацией до $(1-2) \cdot 10^{18}$ см⁻³. Ширина каждой из легированных областей составляла 10 нм.



Рис. 1. Осцилляции Шубникова-де Гааза в образце s7131 в перпендикулярном магнитном поле в интервале температур от 1.5 до 5.5 К. Стрелками отмечены магнитные поля, соответствующие целочисленным факторам заполнения уровней Ландау при $n_S = 1.12 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$.

Мольная доля In в KЯ составляла x = 0.7. Образец в форме холловского мостика размещался в центре сверхпроводящего соленоида. Измерения осцилляций ШдГ и эффекта Холла проводились при непрерывной развертке магнитного поля до 12 Тл в интервале температур от 1.5 до 5.5 К. Через образец пропускался переменный ток I = 1 мкА с частотой 9 Гц, и использовалась стандартная схема синхронного детектирования.

На рис. 1 представлены результаты измерений осцилляций ШдГ магнитосопротивления R_{xx} в перпендикулярных магнитных полях до 12 Тл в интервале температур от 1.5 до 5.5 К. Из анализа результатов магнитотранспортных измерений в слабых магнитных полях и осцилляций ШдГ при T = 1.5 К были определены подвижность (μ) и концентрация (n_S) 2D электронов, которые составили $1.8 \cdot 10^5$ см²/В · с и $1.12 \cdot 10^{12}$ см⁻² соответственно. Отметим, что столь высокое значение подвижности в КЯ In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP при концентрации 2D электронов > 10^{12} см⁻² свидетельствует о высоком качестве образца s7131 (ср. с данными [42–45]). Другим важным параметром, характеризующим процессы рассеяния электронов в образце, является квантовое время жизни, котороя определяет ширину уровней Ландау.

Квантовое время жизни τ_q , а также масса 2D электронов m^* в образце s7131 определялись из анализа температурной зависимости амплитуды осцилляций ШдГ ΔR_{xx} в слабых магнитных полях с помощью следующего выражения [46,47]:

$$\Delta R_{xx} = 4R_0 \frac{2\pi^2 k_{\rm B} T / \hbar \omega_c}{\sinh(2\pi^2 k_{\rm B} T / \hbar \omega_c)} \exp(-\pi / \omega_c \tau_q), \quad (1)$$

где $\omega_c = eB/m^*c$, e > 0 — заряд электрона, B — величина индукции магнитного поля, R_0 — сопротивление в нулевом магнитном поле, $k_{\rm B}$ — постоянная Больцмана, T — температура. В результате значения τ_q и m^* для

образца s7131 оказались равными 0.86 пс и 0.061 m_0 (m_0 — масса свободного электрона) соответственно. Отметим, что циклотронная масса электронов в КЯ In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP шириной 10 нм при заданном значении $n_S = 1.12 \cdot 10^{12}$ см⁻² должна составлять 0.051 m_0 [42]. Различие в 15–20% между значениями эффективной массы, измеряемыми в магнитотранспорте и циклотронном резонансе, является типичным для полупроводниковых структур с 2D электронным газом и связано с электрон-электронным взаимодействием [48]. Зная m^* и μ , можно также оценить транспортное время релаксации импульса: $\tau_{tr} = (m^*/e)\mu \approx 6.3$ пс. Отношение τ_{tr}/τ_q при этом равно 7.3, что в 2 раза ниже, чем в КЯ InAs с более высокими значениями подвижности 2D электронов [49].

Для определения значений эффективного *g*-фактора нами анализировалась температурная зависимость минимумов магнитосопротивления $R_{xx}^{(min)}$ при нечетных факторах заполнения уровней Ландау, вблизи которых наблюдается зеемановское расщепление осцилляций ШдГ. Из рис. 1 видно, что выраженные минимумы $R_{xx}^{(min)}$ наблюдаются вблизи магнитных полей 6.58 и 9.26 Тл, что соответствует факторам заполнения $\nu = 7$ и 5. В этом случае уровень Ферми лежит между расщепленными по спину уровнями Ландау и, если величина щели между уровнями $\Delta_T \gg k_BT$, то зависимость магнитосопротивления от температуры при фиксированном магнитном поле описывается выражением [3,50]

$$R_{xx}^{(\min)} \propto \exp\left(-\frac{\Delta_T}{2k_{\rm B}T}\right).$$
 (2)

В формуле (2) Δ_T не зависит от *T*. Отличие Δ_T от зеемановской энергии $\mu_B g^* B$ (μ_B — магнетон Бора) связано с уширением уровней Ландау (см. рис. 2), обусловленным влиянием случайного потенциала дефектов, неизменно присутствующих в реальных структурах:

$$\Delta_T = \mu_{\rm B} g^* B - 2\Gamma, \qquad (3)$$

где Г — полуширина полосы плотности состояний на уровнях Ландау.

Для описания плотности состояний обычно рассматривается несколько моделей уширения уровней Ландау, в частности лоренцева, гауссова или по-



Рис. 2. Перекрытие плотностей состояний (DOS) расщепленных по спину уровней Ландау (схематически).



Рис. 3. Зависимость положения минимумов магнитосопротивления образца s7131 от температуры при нечетных факторах заполнения уровней Ландау: v = 5 и v = 7. Сплошная и точечные линии — результат подгонки с помощью формулы (2) при низких температурах.

луэллиптическая форма плотности состояний. В лоренцевой модели плотности состояний, описываемой $D_{\rm L}(E) = 1/\pi\Gamma_{\rm L}/[1 + (E/\Gamma_{\rm L})^2]$, ширина уровней Ландау $\Gamma_{\rm L} = \hbar/2\tau_q$ не зависит от магнитного поля [46,47,51]. В гауссовой [50,52] и полуэллиптической [16,53] моделях плотности состояний ширина уровней Ландау пропорциональна $B^{1/2}$ и равна

$$\Gamma = \sqrt{\hbar \omega_c \Gamma_L / \pi}.$$
 (4)

Поскольку гауссова модель плотности состояний дает наилучшее согласие с результатами экспериментальных исследований магнитотранспорта в структурах с КЯ на основе InAs [35,36] и GaAs [50,52], то для описания эффектов уширения уровней Ландау в КЯ на основе раствора InGaAs, мы также будем использовать гауссову модель.

На рис. 3 представлена температурная зависимость положения минимумов магнитосопротивления при нечетных факторах заполнения уровней Ландау $\nu = 5$ и 7. Из анализа линейной зависимости $R_{xx}^{(\min)}$ от обратной температуры в интервале температур от 1.5 до 3.0 К с помощью выражения (2) были получены значения Δ_T для нечетных факторов заполнения, которые составили 0.24 и 0.16 мэВ для $\nu = 5$ и 7 соответственно. Используя τ_q и m^* , определенные из анализа осцилляций ШдГ в образце s7131 в слабых магнитных полях, и гауссову модель плотности состояний, мы определили следующие значения g-фактора квазичастиц: g* = 8.6 для $\nu = 5$ и $g^* = 10.1$ для $\nu = 7$. Отметим, что, хотя в КЯ In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP шириной 10 нм g-фактор квазичастиц (g^*) является отрицательным, в дальнейшем под g^* будет пониматься его абсолютное значение.

Помимо анализа температурной зависимости $R_{xx}^{(\min)}$ для определения *g*-фактора квазичастиц нами также использовался способ, предложенный в работе [3], ос-

нованный на соотношении

$$g^*(B_1) = 2\frac{B_0 m_0}{B_1 m},$$

где B_1 — магнитном поле, в котором появляется зеемановское расщепление осцилляций R_{xx} , B_0 — магнитное поле, в котором возникают осцилляции ШдГ ($B_0 = 1.45$ Тл, см. рис. 1). Значение *g*-фактора квазичастиц, определенное таким образом, оказалось равным 9.2 для магнитного поля $B_1 = 5.15$ Тл ($\nu = 9$).

3. Результаты и обсуждение

Для описания электронных состояний в КЯ на основе узкозонных полупроводников и их растворов необходимо использовать 8-зонный $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ -гамильтониан, в котором $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ -взаимодействие зоны проводимости (Γ_6) с валентными зонами легких и тяжелых дырок (Γ_8), а также с зоной спин-отщепленных дырок (Γ_7) рассматривается точно. Отметим, что при этом взаимодействием с другими, более удаленными зонами можно пренебречь [5,18–21,42]. В таком подходе в явном виде учитывается влияние непараболичности закона дисперсии и спин-орбитального взаимодействия на волновые функции одноэлектронных состояний, что позволяет корректным образом описывать различные многочастичные эффекты в 2D структурах на основе узкозонных полупроводников [27–30].

Для описания результатов исследования магнитотранспорта в образце s7131 нами были выполнены теоретические расчеты g-фактора квазичастиц при нулевой температуре как функции магнитного поля на основе 8-зонного **k** · **p**-гамильтониана с учетом слагаемых, описывающих влияние эффектов упругой деформации на энергетический спектр электронов. Влияние обменного взаимодействия на перенормировку g-фактора описывалось в рамках приближения Хартри—Фока с учетом эффектов экранирования [35]. Описание уширения уровней Ландау проводилось в гауссовой модели плотности состояний. Значения параметров материалов InP и твердого раствора In_{0.7}Ga_{0.3}As, использовавшиеся в расчетах, представлены в [54].

Важнейшим зонным параметром, определяющим спиновое расщепление уровней Ландау, помимо энергии спин-орбитального взаимодействия Δ , является значение g-фактора на дне зоны проводимости в объемном материале (g_c) [29,35]. Для InP нами использовалось значение $g_c = +1.26$, полученное в работе [55] из измерений спинового резонанса. Для твердого раствора In_{0.7}Ga_{0.3}As эта величина неизвестна, поэтому нами была выбрана квадратичная аппроксимация для g_c как функции x в растворе In_xGa_{1-x}As с использованием значений $g_c = -15.1$ в InAs (x = 1), $g_c = -0.44$ в GaAs (x = 0) и значением $g_c = -4.07$, известным из измерений спинового резонанса в объемном растворе In_{0.53}Ga_{0.47}As [56–58].



Рис. 4. Осцилляции *g*-фактора квазичастиц в образце s7131 при различных значениях τ_q , рассчитанные в "экранированном" приближении Хартри-Фока. Толстая сплошная кривая — результаты одноэлектронного расчета. Точки соответствуют экспериментальным значениям g^* , полученным из анализа осцилляций ШдГ при $\nu = 5$, 7 и 9. Стрелками отмечены магнитные поля, соответствующие целочисленным факторам заполнения уровней Ландау.

На рис. 4 представлены результаты численных расчетов *g*-фактора квазичастиц при нулевой температуре как функции магнитного поля в образце s7131 при различных значениях τ_q : 0.86 пс (сплошная кривая), 0.57 пс (точечная кривая) и 0.29 пс (штриховая кривая). Приведена также кривая, соответствующая "одноэлектронным" значениям g-фактора в КЯ In_{0.53}Ga_{0.47}As/InP. Точки соответствуют экспериментальным значениям g* при v = 5, 7 и 9, полученным из анализа осцилляций ШдГ. Особенности "одноэлектронного" g-фактора, возникающие при четных факторах заполнения уровней Ландау, связаны с осцилляциями уровня Ферми в магнитном поле и являются типичными для 2D структур с непараболичным законом дисперсии [5,27,29,35-37]. При увеличении магнитного поля уровень Ферми "перескакивает" с одной пары расщепленных по спину уровней Ландау на нижележащую пару, спиновое расщепление которой больше (см., например, рис. 2 в работе [35]), в результате происходит скачок величины спинового расщепления на уровне Ферми.

Учет обменного взаимодействия приводит к значительному усилению g-фактора квазичастиц. Осциллирующее поведение g-фактора связано с осцилляциями уровня Ферми в магнитном поле, что впервые было отмечено в работе [15]. Отметим, что усиление при четных значениях фактора заполнения уровней Ландау имеет место только в 2D структурах с непараболичным законом дисперсии [5,35,37].

Точки на рис. 4 соответствуют значениям g^* , полученным из анализа осцилляций ШдГ при $\nu = 5, 7$ и 9. Видно, что экспериментальные значения g-фактора квазичастиц в образце s7131 находятся в удовлетворительном согласии с теоретическими расчетами при $\tau_q = 0.86$ пс.



Рис. 5. Зависимость плотности состояний на уровне Ферми в образце s7131 от магнитного поля при различных значениях квантового времени жизни τ_q (ширины уровней Ландау).

Различие теоретической кривой и экспериментальных значений g^* в образце s7131 связывается нами с зависимостью ширины уровней Ландау от магнитного поля, отличной от выражения (4). Отметим, что корневая зависимость $\Gamma(B)$, описываемая выражением (4), имеет место только в случае рассеяния 2D электронов на короткодействующем потенциале примесей [15,53]. В реальных 2D структурах зависимость ширины уровней Ландау в сильном магнитном поле принимает более сложный вид [10,11], что, в свою очередь, приводит к изменению формы и амплитуды осцилляций *g*-фактора квазичастиц.

На рис. 5 представлены результаты расчета плотности состояний на уровне Ферми, DOS $(E_{\rm F})$, как функции магнитного поля в КЯ In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP шириной 10 нм при нулевой температуре и различных значениях квантового времени жизни τ_q (ширины уровней Ландау). Как видно из рис. 5, при четных факторах заполнения уровней Ландау плотность состояний на уровне Ферми обращается в нуль, что связано с тем, что в заданном диапазоне магнитных полей $\hbar\omega_c\gg 2\Gamma$ при всех рассматриваемых значениях т_а. В сильных магнитных полях перекрытие расщепленных по спину уровней Ландау уменьшается, что приводит к уменьшению значения плотности состояний на уровне Ферми и ее расщеплению на два пика вблизи нечетных факторов заполнения. Максимум каждого пика плотности состояний соответствует магнитному полю, в котором пересекаются соответствующий уровень Ландау и уровень Ферми. Видно, что при значении $\tau_q = 0.86$ пс, характерном для образца s7131, зеемановское расщепление плотности состояний на уровне Ферми начинается при $\nu = 13$, в то время как зеемановское расщепление осцилляций магнитосопротивления (см. рис. 1) наблюдается начиная с $\nu = 9$. Это связано с тем, что величина осцилляций ШдГ пропорциональна не только квадрату плотности состояний на уровне Ферми, но также и усредненному

по поверхности Ферми значению квадрата модуля матричного элемента оператора скорости [59,60].

Из рис. 4 и 5 видно, что не только амплитуда, но и форма осцилляций *g*-фактора квазичастиц зависит от величины перекрытия соседних спин-расщепленных уровней Ландау. Это связано с тем, что величина *g*-фактора определяется не только разностью концентраций 2D электронов с противоположными спинами, но и диэлектрической проницаемостью 2D электронного газа, которая, в свою очередь, связана с плотностями состояний отдельных уровней Ландау на уровне Ферми (см. более подробно в [35]).

Как видно из рис. 4 и 5, максимум g-фактора квазичастиц соответствует нечетным факторам заполнения только при небольшом перекрытии плотностей состояний спин-расщепленных уровней Ландау, когда $\tau_q \ge 0.57$ пс. При увеличении перекрытия плотностей состояний спин-расщепленных уровней Ландау ($\tau_q = 0.29$ пс) зеемановское расщепление плотности состояний на уровне Ферми (рис. 5) в окрестности нечетных факторов заполнения исчезает, а экранирование обменного взаимодействия, наоборот, увеличивается, что приводит к уменьшению обменного усиления g-фактора квазичастиц. В результате увеличения экранирования обменного взаимодействия в окрестности нечетных фактора квазичастия, максимальное значение g-фактора смещается в сторону меньших магнитных полей (рис. 4).

Появление "пиковых" особенностей *g*-фактора квазичастиц вблизи четных факторов заполнения уровней Ландау (см. рис. 4) также обусловлено экранированием обменного взаимодействия в 2D электронном газе. На рис. 6 представлены результаты расчетов *g*-фактора



Рис. 6. Зависимость *g*-фактора квазичастиц от магнитного поля в КЯ $In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP$ шириной 10 нм, с концентрацией 2D электронного газа $n_S = 1.12 \cdot 10^{12}$ см⁻² и $\tau_q = 0.86$ пс, рассчитанная с учетом (сплошная кривая) и без учета (точечная кривая) экранировки. Толстая сплошная кривая — результаты одноэлектронного расчета. Стрелками отмечены магнитные поля, соответствующие целочисленным факторам заполнения уровней Ландау. На вставке — результаты расчета в слабых магнитных полях.

квазичастиц как функции магнитного поля в образце s7131, выполненные с учетом (сплошная кривая) и без учета (точечная кривая) эффектов экранирования обменного взаимодействия. Приведена также кривая, соответствующая результатам одночастичного расчета g-фактора 2D электронов на уровне Ферми. На вставке показаны результаты расчетов в слабых магнитных полях. Из сравнения кривых на рис. 5 и 6, соответствующих $\tau_q = 0.86$ пс, видно, что в той области, где плотность состояний на уровне Ферми имеет локальный минимум, g-фактор квазичастиц имеет локальный максимум.

При четных факторах заполнения суммарная плотность состояний (рис. 5) на уровне Ферми равна нулю. Небольшое увеличение магнитного поля приводит к резкому возрастанию плотности состояний на уровне Ферми и значительному увеличению экранирования обменного взаимодействия 2D электронов, в результате чего обменное усиление *g*-фактора уменьшается. При дальнейшем увеличении магнитного поля разность обменных поправок к спин-расщепленным уровням Ландау, которая определяет перенормировку *g*-фактора квазичастиц [35,37], возрастает за счет увеличения разности концентраций электронов с противоположными спинами в системе. Таким образом, в окрестности четных факторов заполнения уровней Ландау должен появиться локальный максимум *g*-фактора квазичастиц.

Локальный минимум плотности состояний на уровне Ферми приводит к уменьшению экранирования обменного взаимодействия в окрестности нечетных факторов заполнения. В результате максимальное значение g-фактора квазичастиц приближается к значению, соответствующему неэкранированному кулоновскому потенциалу (см. рис. 6). Как видно из рис. 4–6, при сильном перекрытии спин-расщепленных уровней Ландау, имеющим место в слабых магнитных полях или при уменьшении значений τ_q , величина максимума g-фактора квазичастиц при четных факторах заполнения может даже превышать значения g-фактора вблизи нечетных факторов заполнения уровней Ландау.

В наших предыдущих теоретических расчетах обменного усиления g-фактора квазичастиц в КЯ InAs/ AlSb [5,35-37], выполненных при типичных значениях концентрации и подвижности 2D электронов, характерных для экспериментально исследовавшихся образцов [2-5,18,21], локального максимума при четных факторах заполнения уровней Ландау обнаружено не было. Однако теоретические расчеты, выполненные нами при больших значениях концентрации и ширины уровней Ландау, не характерных для реальных образцов с КЯ InAs/AlSb, позволили выявить "пиковые" особенности *g*-фактора вблизи четных факторов заполнения и в этих структурах. Отметим, что в отсутствие непараболичности в законе дисперсии 2D электронов максимума g-фактора квазичастиц при четных факторах заполнения уровней Ландау не существует.

4. Заключение

В настоящей работе исследовано обменное усиление g-фактора квазичастиц в гетероструктурах с КЯ In_{0.7}Ga_{0.3}As/InP. Из анализа осцилляций Шубниковаде Гааза вблизи нечетных факторов заполнения уровней Ландау определены значения g-фактора квазичастиц $g^* = -(8.6-10.1)$. Полученные значения находятся в хорошем согласии с теоретическими расчетами, выполненными с использованием 8-зонного k · p-гамильтониана и с учетом обменного взаимодействия в 2D электронном газе. Впервые показано появление локального максимума g-фактора квазичастиц вблизи четных факторов заполнения уровней Ландау, не существующего в 2D структурах с параболичным законом дисперсии электронов. Величина локального максимума вблизи четных факторов может значительно превышать значение д-фактора вблизи нечетных факторов заполнения при сильном перекрытии спин-расщепленных уровней Ландау.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 12-02-00940, 13-02-00894), Российской академии наук и грантов президента РФ (МК-4758.2014.2, НШ-1214.2014.2).

Авторы благодарят за поддержку Фонд некоммерческих программ "Династия".

Список литературы

- [1] F.F. Fang, P.J. Stiles. Phys. Rev., 174, 823 (1968).
- [2] S. Brosig, K. Ensslin, A.G. Jansen, C. Nguyen, B. Brar, M. Thomas, H. Kroemer. Phys. Rev. B, 61, 13045 (2000).
- [3] V.N. Zverev, M. Muhammad, S. Rahman, P. Debray, M. Saglam, J. Sigmund, H.L. Hartnage. J. Appl. Phys., 96, 6353 (2004).
- [4] В.Я. Алёшкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, С.С. Криштопенко, Ю.Г. Садофьев, К.Е. Спирин. ФТП, 42, 846 (2008) [Semiconductors, 42, 828 (2008)].
- [5] С.С. Криштопенко, К.П. Калинин, В.И. Гавриленко, Ю.Г. Садофьев, М. Goiran. ФТП, 46, 1186 (2012) [Semiconductors, 46, 1163 (2012)].
- [6] T.P. Smith, B.B. Goldberg, P.J. Stiles, M. Heiblum. Phys. Rev. B, 32, 2696 (1985).
- [7] E.E. Mendez, H. Ohno, L. Esaki, W.I. Wang. Phys. Rev. B, 43, 5196 (1991).
- [8] E.E. Mendez, J. Nocera, W.I. Wang. Phys. Rev. B, 47, 13 937 (1993).
- [9] E. Gornik, R. Lassnig, G. Strasser, H.L. Stormer, A.C. Gossard, W. Wiegmann. Phys. Rev. Lett., 54, 1820 (1985).
- [10] J.K. Wang, J.H. Campbell, D.C. Tsui, A.Y. Cho. Phys. Rev. B, 38, 6174 (1988).
- [11] J.K. Wang, D.C. Tsui, M. Santos, M. Shayegan. Phys. Rev. B, 45, 4384 (1992).
- [12] H.B. Chan, P.I. Glicofridis, R.C. Ashoori, M.R. Melloch. Phys. Rev. Lett., **79**, 2867 (1997).
- [13] O.E. Dial, R.C. Ashoori, L.N. Pfeiffer, K.W. West. Nature (London), 448, 176 (2007).
- [14] J.F. Janak. Phys. Rev., 178, 1416 (1969).

- [15] T. Ando, Y. Uemura. J. Phys. Soc. Jpn., 37, 1044 (1974).
- [16] M. Califano, T. Chakraborty, P. Pietiläinen, C.-M. Hu. Phys. Rev. B, 73, 113 315 (2006).
- [17] M.J. Yang, P.J. Lin-Chung, B.V. Shanabrook, J.R. Waterman, R.J. Wagner, W.J. Moore. Phys. Rev. B, 47, 1691 (1993).
- [18] A. Ikonnikov, S. Krishtopenko, V. Gavrilenko, Yu. Sadofyev, Yu. Vasilyev, M. Orlita, W. Knap. J. Low Temp. Phys., 159, 197 (2010).
- [19] В.И. Гавриленко, С.С. Криштопенко, М. Goiran. ΦΤΠ, 45, 111 (2011) [Semiconductors, 45, 110 (2011)].
- [20] К.Е. Спирин, К.П. Калинин, С.С. Криштопенко, К.В. Маремьянин, В.И. Гавриленко, Ю.Г. Садофьев. ФТП, 46, 1424 (2012) [Semiconductors, 46, 1396 (2012)].
- [21] S.S. Krishtopenko, A.V. Ikonnikov, K.V. Maremyanin, K.E. Spirin, V.I. Gavrilenko, Yu.G. Sadofyev, M. Goiran, M. Sadowsky, Yu.B. Vasilyev. J. Appl. Phys., **111**, 093 711 (2012).
- [22] G.A. Khodaparast, R.C. Meyer, X.H. Zhang, T. Kasturiarachchi, R.E. Doezema, S.J. Chung, N. Goel, M.B. Santos, Y.J. Wang. Physica E, 20, 386 (2004).
- [23] A.M. Gilbertson, W.R. Branford, M. Fearn, L. Buckle, P.D. Buckle, T. Ashley, L.F. Cohen. Phys. Rev. B, 79, 235 333 (2009).
- [24] Ю.Б. Васильев, F. Gouider, G. Nachtwei, P.D. Buckle. ФТП
 44, 1559 (2010) [Semiconductors, 44, 1511 (2010)].
- [25] F. Gouider, Yu.B. Vasilyev, M. Bugar, J. Konemann, P.D. Buckle, G. Nachtwei. Phys. Rev. B, 81, 155 304 (2010).
- [26] B. Rupprecht, S. Heedt, H. Hardtdegen, Th. Schäpers, Ch. Heyn, M.A. Wilde, D. Grundler. Phys. Rev. B, 87, 035 307 (2013).
- [27] S.S. Krishtopenko, V.I. Gavrilenko, M. Goiran. J. Phys.: Condens. Matter, 24, 252 201 (2012).
- [28] S.S. Krishtopenko. J. Phys.: Condens. Matter, 25, 105601 (2013).
- [29] S.S. Krishtopenko, V.I. Gavrilenko, M. Goiran. Phys. Rev. B, 87, 155 113 (2013).
- [30] S.S. Krishtopenko. J. Phys.: Condens. Matter, 25, 365602 (2013).
- [31] Deborah L. Vehse, S.G. Hummel, H.M. Cox, F. DeRosa, S.J. Allen, jr. Phys. Rev. B, 33, 5862 (1986).
- [32] I.G. Savel'ev, A.M. Kreshchuk, S.V. Novikov, A.Y. Shik, G. Remenyi, Gy. Kovács, B. Pôdörk, G. Gombos. J. Phys.: Condens. Matter, 8, 9025 (1996).
- [33] J.C. Portal, R.J. Nicholas, M.A. Brummell, M. Razeghi, M.A. Poisson. Appl. Phys. Lett., 43, 293 (1983).
- [34] S. Koch, R.J. Haug, K. v. Klitzing, M. Razeghi. Phys. Rev. B, 47, 4048 (1993).
- [35] S.S. Krishtopenko, V.I. Gavrilenko, M. Goiran. J. Phys.: Condens. Matter, 23, 385 601 (2011).
- [36] S.S. Krishtopenko, V.I. Gavrilenko, M. Goiran. Sol. St. Phenomena, 190, 554 (2012).
- [37] S.S. Krishtopenko, V.I. Gavrilenko, M. Goiran. J. Phys.: Condens. Matter, 24, 135 601 (2012).
- [38] G.R. Johnson, A. Kanaah, B.C. Cavenett, M.S. Skolnick, S.J. Bass. Semicond. Sci. Technol., 2, 182 (1987).
- [39] M. Dobers, J.P. Vieren, Y. Guldner, P. Bove, F. Omnes, M. Razeghi. Phys. Rev. B, 40, 8075 (1989).
- [40] B. Kowalski, P. Omling, B.K. Meyer, D.M. Hofmann, C. Wetzel, V. Härlex, F. Scholz, P. Sobkowicz. Phys. Rev. B, 49, 14786 (1994).

- [41] B. Kowalski, P. Omling, B.K. Meyer, D.M. Hofmann, V. Härlex, F. Scholz, P. Sobkowicz. Semicond. Sci. Technol., 11, 1416 (1996).
- [42] К.П. Калинин, С.С. Криштопенко, К.В. Маремьянин, К.Е. Спирин, В.И. Гавриленко, А.А. Бирюков, Н.В. Байдусь, Б.Н. Звонков. ФТП, 47, 1497 (2013) [Semiconductors, 47, 1485 (2013)].
- [43] C. Wetzel, R. Winkler, M. Drechsler, B.K. Meyer, U. Rössler, J. Scriba, J.P. Kotthaus, V. Härle, F. Scholz. Phys. Rev. B, 53, 1038 (1996).
- [44] G. Engels, J. Lange, Th. Schäpers, H. Lüth. Phys. Rev. B, 55, 1958 (1997).
- [45] S.A. Studenikin, G. Granger, A. Kam, A.S. Sachrajda, Z.R. Wasilewski, P.J. Poole. Phys. Rev. B, 86, 115 309 (2012).
- [46] A. Isihara, L. Smrcka. J. Phys. C, 19, 6777 (1986).
- [47] P.T. Coleridge. Phys. Rev. B, 44, 3793 (1991).
- [48] Y.-W. Tan, J. Zhu, H.L. Stormer, L.N. Pfeiffer, K.W. Baldwin, K.W. West. Phys. Rev. Lett., 94, 016 405 (2005).
- [49] N.A. Kabir, Y. Yoon, J.R. Knab, J.-Y. Chen, A.G. Markelz, J.L. Reno, Y. Sadofyev, S. Johnson, Y.-H. Zhang, J.P. Bird. Appl. Phys. Lett., 89, 132 109 (2006).
- [50] A. Usher, R.J. Nicholas, J.J. Harris, C.T. Foxon. Phys. Rev. B, 41, 1129 (1990).
- [51] P.T. Coleridge, R. Stoner, R. Fletcher. Phys. Rev. B, 39, 1120 (1989).
- [52] A. Endo, Y. Iye. J. Phys. Soc. Jpn., 77, 064713 (2008).
- [53] T. Ando, Y. Uemura. J. Phys. Soc. Jpn., 36, 959 (1974).
- [54] I. Vurgaftman, J.R. Meyer, L.R. Ram-Mohan. J. Appl. Phys., 89, 5815 (2001).
- [55] C. Weisbuch, C. Hermann. Sol. St. Commun., 16, 659 (1975).
- [56] J. Beerens, C.J. Miner, N. Puetz. Semicond. Sci. Technol., 10, 1233 (1995).
- [57] B. Kowalski, H. Linke, P. Omling. Phys. Rev. B, 54, 8551 (1996).
- [58] S. Charlebois, J. Beerens, C.J. Miner, N. Puetz. Phys. Rev. B, 54, 13456 (1996).
- [59] S.R.E. Yang, A.H. MacDonald, B. Huckestein. Phys. Rev. Lett., 74, 3229 (1995).
- [60] А.А. Грешнов, Г.Г. Зегря. ФТП, **47**, 1347 (2007) [Semiconductors, **41**, 1329 (2007)].

Редактор Л.В. Шаронова

Exchange enhancement of electron g-factor in strained InGaAs/InP heterostructures

S.S. Krishtopenko^{+*}, K.V. Maremyanin^{+*}, K.P. Kalinin^{+†}, K.E. Spirin^{+*•}, V.I. Gavrilenko^{+*}, N.V. Baidus^{*}, B.N. Zvonkov^{*}

⁺ Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences, 60950 Nizhny Novgorod, Russia
* Lobachevsky State University, 603950 Nizhny Novgorod, Russia
[†] Moscow Institute of Physics and Technology (Department of General and Applied Physics), 141700 Dolgoprudny, Russia
• International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, 95 Gajowicka str., 53-421, Wroclaw, Poland

Abstract We report investigation of exchange enhancement of electron *g*-factor in strained InGaAs/InP heterostructures with two-dimensional (2D) electron gas. By analyzing temperature dependence of the resistance minima of Shubnikov–de Haas oscillations in perpendicular magnetic fields up to 12 T in the vicinity of odd filling factors of Landau levels, the values of effective electron Lande factor $g^* = -(8.6 - 10.1)$ are determined. The experimental values are compared with theoretical calculations of quasiparticle *g*-factor performed by using the eight-band $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ Hamiltonian and taking into account the exchange interaction in 2D electron gas. We show that the quasiparticle *g*-factor could reach the maximum value in the vicinity of even filling factors in the presence of large overlapping of spin-split Landau levels.

Публикация материалов Конференции завершена.